

в форме Web of Science: Chemical Abstracts Service (CAS), которая входит в Medline, Russian Science Citation Index (RSCI).

Индекс научного цитирования (РИНЦ) и включен в международную базу INSPEC ВАК России по техническим, физико-математическим и химическим наукам.

Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук публикуются в журнале на русском и английском языках

ISSN 8866-8866 DOI: 10.17587/issn1813-8586

Издается с 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Ларионов Ю. В. Сканирование поверхности кремния в высоковольтном РЭМ без контаминации 323

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

Гусев Е. Э., Дедкова А. А., Дюжев Н. А., Ковалёв А. С., Онуфриенко А. П. Исследование влияния операционных параметров процесса PECVD на характеристики пленок диоксида кремния 331

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

Деспотули А. Л., Андреева А. В. Размерные факторы и нелинейные процессы в структурно-динамическом подходе наноэлектроники 338

Рубцов Ю. В., Алексеева А. В. Разработка IBIS-модели микросхем концентраторов сетей, применяемых для проектирования телекоммуникационной аппаратуры 352

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Драгунов В. П., Киселев Д. Е., Синицкий Р. Е. Особенности электро-механических взаимодействий в МЭМС с непараллельными электродами 360

Караян Г. С., Гандилян С. В., Гандилян В. В. Современное состояние и перспективы развития микросистемной электромеханики . . . 370

Садков В. Д., Фомина К. С. Расчет сопротивления пленочного элемента произвольной формы 380